

文献[4]。由图2知,当 $\nu < 1.2025$ 时,零序衍射光强的包络线与声波的包络相同。如用声音讯号去调制声驻波,则光波中亦带有声音讯号。图1中用声音讯号去调制电讯号。光电倍增管采用RC负载,电容C滤去高频光分量即可获得声音讯号,用此声音讯号驱动扬声器。图1所示装置即是一种激光电话实验装置。它的特点是调制与解调都很方便。

由式(1),(5)知,衍射光强与 ν 的关系是贝

塞尔函数平方关系,而 ν 在光波波长一定声光介质一定的情况下只与声功率有关,而与介质中的声波形状无关。由图2当已知衍射光强波形后可用作图法绘出介质中的声波波形。

参 考 文 献

- [1] B. D. Cook, E. A. Hiedemann, *J. Acoust. Soc. Am.*, **33**-7 (1961), 945—948.
- [2] L. E. Hargrove, *IEEE SU-14-1* (1967), 33—36.
- [3] 于连生,激光、**6**-6(1979),
- [4] 于连生,激光, 7-8,(1980).

硫系 $\text{Ge}_{15}\text{Te}_{81}\text{S}_2\text{Sb}_2$ 非晶态半导体薄膜的电导特性

陈宗才 钟伯强

(中国科学院上海硅酸盐研究所)

1980年10月9日收到

近年来,我们用硫系非晶态半导体 $\text{Ge}_{15}\text{Te}_{81}\text{S}_2\text{Sb}_2$ 材料研制的 8×8 位主读存储器,已在本所自动控制中试用,效果良好。为探讨电性机理,测量了该材料的交、直流电导特性。

一、样品制备

先将光谱纯的 Ge, Te, S, Sb 各元素按组份配制成靶,在真空中再将靶料溅射于已制好钼电极的基片上,光刻成直径为 $20 \mu\text{m}$ 、厚 $1.5 \mu\text{m}$ 的薄膜,其上再溅射并光刻上钼电极。

二、实验结果及分析

$\text{Ge}_{15}\text{Te}_{81}\text{S}_2\text{Sb}_2$ 薄膜的电导是温度和外电场频率的函数。总电导 $\sigma(\omega, T)$ 可表示为直流电导 $\sigma_{dc}(T)$ 与交流电导 $\sigma_{ac}(\omega, T)$ 之和的形式,即 $\sigma(\omega, T) = \sigma_{dc}(T) + \sigma_{ac}(\omega, T)$ 。在不同温度范围,二者对总电导贡献的大小亦不同。

1. 直流电导 $\sigma_{dc}(T)$

在 $201 \sim 400\text{K}$ 范围,温度从高到低,在 $\ln \sigma_{dc}$ 与 $1/T$ 的关系中观察到两个线性区,如图

物理

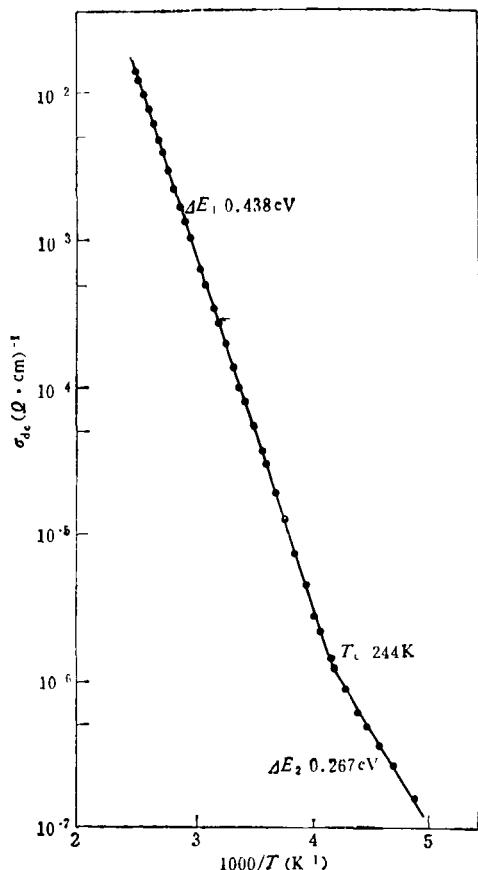


图1 直流电导与温度的关系

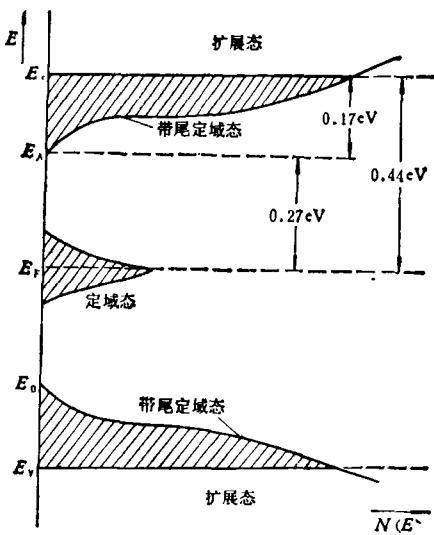


图 2 能态密度图

1 所示。这一特性可用下式描述：

$$\sigma_{dc}(T) = \sigma_{01}e^{-\Delta E_1/kT} + \sigma_{02}e^{-\Delta E_2/kT}, \quad (1)$$

式中 k 是玻耳兹曼常数， T 是绝对温度。两个线性区反映了载流子在两种区域的运输。 $T > 244K$ [(1)式中第一项]的高温区表明，载流子被热激发到迁移率边以上的扩展态运输(如图 2)。此时载流子有较大的迁移率，故 σ_{01} 较大。对于非晶态半导体， σ_{01} 与扩展态迁移率 μ_c 的关系可表为^[1]

$$\sigma_{01} = eN(E_c)kT\mu_c e^{\gamma/k}, \quad (2)$$

式中 $N(E_c)$ 是迁移率边处之能态密度， γ 是迁移率隙随温度的变化率。若取

$$\gamma = 3 \times 10^{-4}eV/K,$$

$N(E_c)kT$ 为 $5 \times 10^{19}cm^{-3}$ ， σ_{01} 为 $0.15(\Omega \cdot cm)^{-1}$ ，代入(2)得 $\mu_c = 1.5 \times 10^{-2}cm^2/V \cdot s$

激活能 $\Delta E_1 = E_c - E_p$ 为 $0.438eV$ 。在大多数共价键非晶态半导体中，存在着 $10^{17} \sim 10^{19} cm^{-3}$ 的缺陷态密度，它往往将 E_p “钉死”在迁移率隙中心附近，因而可视 $E_c - E_p$ 为光学能隙的一半。故材料之迁移率隙为 $0.876eV$ 。这与 Owen^[2] 的结果 ($0.88eV$) 相近。

$T < 244K$ [(1) 式中第二项]的低温区表明，载流子在热激发下跃迁到带尾定域态运输。此时，载流子的迁移率较小，估计值为 1×10^{-4}

$cm^2/V \cdot s$ 。从而导致 σ_{02} 较小 [其值为 $10^{-3}(\Omega \cdot cm)^{-1}$]，故电导率亦较小。激活能 $\Delta E_2 = E_A - E_p$ 为 $0.27eV$ 。由此，带尾定域态之宽度为 $0.17eV$ 。

2. 直流电导的退火效应

图 3 是样品经过退火处理前后所测得之 $\ln \sigma_{dc}$ 与 $1/T$ 的关系。退火后 ΔE_1 由 $0.35eV$ 增加到 $0.39eV$ ， ΔE_2 由 $0.25eV$ 增加到 $0.27eV$ ；同时定域态电导率变小。其原因是(1)退火处理后材料结构有微小变化，使迁移率隙变宽，故 ΔE 增大；(2)退火处理使迁移率边附近的等效能态密度减小，引起 σ_{02} 减小，从而电导率亦随之减小。

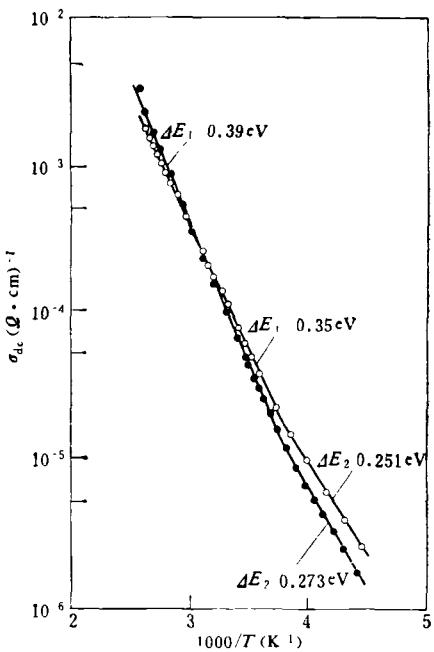


图 3 退火处理对激活能及电导率的影响
○退火处理前；●退火处理后

图 4 是三种不同厚度样品之 $\ln \sigma_{dc}$ 与 $1/T$ 的关系。从图中可知， ΔE 在 $0.40 \sim 0.49 eV$ 范围，基本上与厚度无关。其中厚为 $1\mu m$ 和 $1.53\mu m$ 样品之 ΔE 更为接近，而厚为 $2.8\mu m$ 样品之 ΔE 相差稍大些，这种差异亦可用退火效应加以解释。

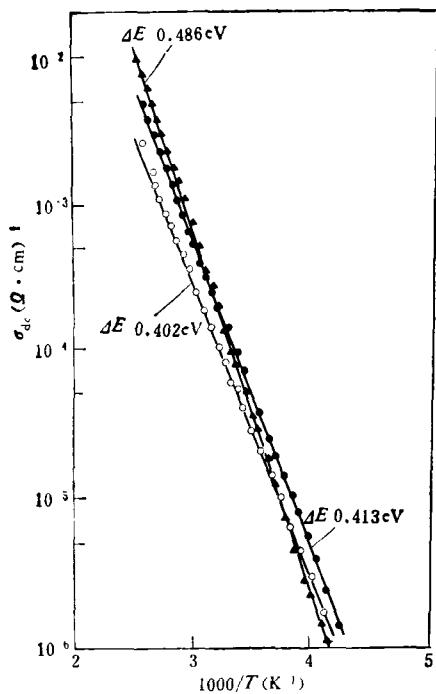


图 4 三种厚度样品之直流电导与温度的关系
 ●膜厚 $1\mu\text{m}$; ○膜厚 $1.53\mu\text{m}$; ▲膜厚 $2.80\mu\text{m}$

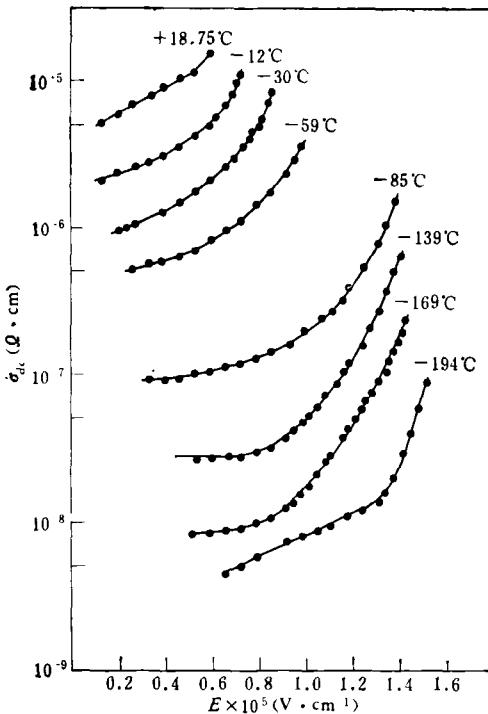


图 5 直流电导与外电场的关系

3. 直流电导 $\sigma_{dc}(T)$ 与外电场的关系

$\text{Ge}_{15}\text{Te}_{81}\text{S}_2\text{Sb}_2$ 材料之直流电导是外电场场强的函数, 如图 5 所示。与 Owen^[2] 得到该材料的曲线基本相似。当电场 $E < 1 \times 10^5 \text{ V} \cdot \text{cm}^{-1}$ 时, 电导随电场缓慢地增加; 而当电场 $E > 1 \times 10^5 \text{ V} \cdot \text{cm}^{-1}$ 时, 电导便随电场迅速地增加。电导增加快慢的转折点随温度升高而向低场方向移动, 到 188K 时, 转折点已不明显了。

4. 交流电导 $\sigma_{ac}(\omega, T)$

在 $154\sim385\text{K}$ 温度范围, 测量了 400Hz , 1KHz 和 10KHz 三种频率时交流电导与温度的关系, 如图 6 所示。从图中可知: 高温时, 不同频率的交流电导逐渐趋于直流电导值。此时, 交流电导对总电导的贡献很小。总电导由直流电导所支配。换言之, 载流子受热激发跃迁比外场对它的作用要大得多。在较低温度下, 直流电导比交流电导要小一个数量级以上。此时, 总电导由交流电导所支配。亦即, 载流子靠电场作用跃迁比热激发跃迁要强得多。交流电导与温度无明显关系。

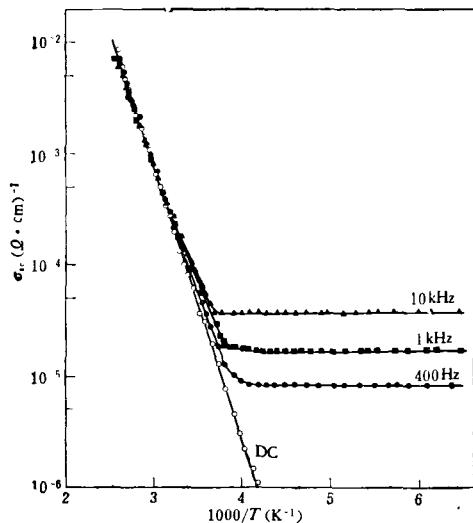


图 6 不同频率下交流电导与温度的关系

在 10^4 Hz 至 10^7 Hz 频率范围, 测量了 221.5K 时交流电导 $\sigma_{ac}(\omega)$ 与频率 ω 的关系, 如图 7 所示。它遵从关系式

$$\sigma_{ac}(\omega) = A\omega^s, \quad 0.99 < s < 1.095.$$

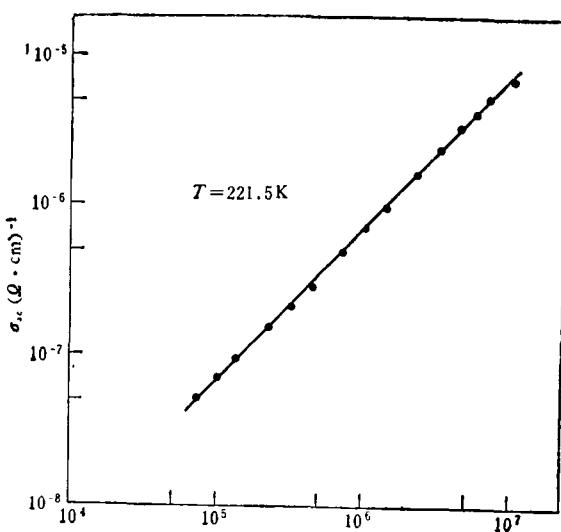


图 7 221.5K 时交流电导与频率的关系

三、理论模型探讨

Austin 和 Mott^[3] 认为, 低温下之交流电导是载流子在电场作用和热激发下, 借声子的协助, 以隧道方式在两个定域态间跃迁所形成的. 并利用 Pollak 和 Geballe^[4] 的理论得到

$$\sigma_{ac}(\omega, T) = \frac{\pi}{3} [N(E_p)]^2 k T e^2 \alpha^{-5} \omega \cdot [\ln(\nu_{ph}/\omega)]^4, \quad (3)$$

式中 $N(E_p)$ 是费密能级附近的态密度, α 是波函数衰减半径, ν_{ph} 是声子频率. (3) 式所表述的隧道跃迁模型之关系式在以下几方面与实验结果不符:

(1) $\sigma_{ac}(\omega, T) \propto T$, 即低温下, 交流电导与温度成直接线性关系;

(2) $\sigma_{ac}(\omega, T) \propto \omega [\ln(\nu_{ph}/\omega)]^4 \sim \omega^s$. 根据 $s = \frac{d(\ln \sigma)}{d(\ln \omega)}$ 的定义得到

$$s = 1 - \frac{4}{\ln(\nu_{ph}/\omega)}. \quad (4)$$

(4) 式表明, s 依赖于声子频率, 它的大小受到严格限制. 当 s 值较小时, 所得 ν_{ph} 是正常的. 例如 s 取 0.80, ω 取 10^5 Hz, 则 ν_{ph} 为 4.99×10^{13} Hz; 但当 s 较大时, ν_{ph} 就大得不可思议了. 例如在相同 ω 下, s 取 0.96, 则 ν_{ph} 为 $2.69 \times$

10^{48} Hz. 对于 $s > 1$ 的情形, (4) 式就更无法解释了.

(3) s 是温度的函数, 因为 ν_{ph} 随温度升高而增大. 若声子的束缚能为 W_p , 则

$$\nu_{ph} = \nu_0 e^{-W_p/2kT}.$$

其中 ν_0 是不失真格子之频率. 代入(4)并求导数得

$$\frac{ds}{dT} = + \frac{4W_p}{2kT^2} \cdot \frac{1}{\{\ln(\nu_0/\omega) - W_p/2kT\}^2}$$

为正值.

为克服上述困难, Elliott^[5] 提出了载流子在两个定域态间跃迁时, 是从势垒上面越过该势垒的模型, 并得到

$$\sigma_{ac}(\omega) = \frac{\pi^2 N^2 \epsilon}{24} \left[\frac{8e^2}{\epsilon W_M} \right]^6 \cdot \frac{\omega^s}{\nu_0^\beta}, \quad (5)$$

式中 W_M 是跃迁所需之能量, 近似为带宽. $s = 1 - \beta$, $\beta = \frac{6kT}{W_M}$. 由(5)式知: (1) 低温下, $\sigma_{ac}(\omega)$ 与 T 不成明显的函数关系; (2) $\sigma_{ac}(\omega)$ 的大小取决于 W_M^{-6} , 而与声子频率无关; (3) 由 s 对 T 求导数得到 $\frac{ds}{dT} = - \frac{6k}{W_M}$, 为负值. 实验得出 $\frac{\Delta s}{\Delta T} = -6.23 \times 10^{-4} (\text{K}^{-1})$, 算出 $W_M = 0.83 \text{ eV}$, 与带宽测量值 0.88 eV 之结果相近.

由以上分析可知, Elliott 的越过势垒跃迁模型能较好地解释 $\text{Ge}_{15}\text{Te}_{85}\text{S}_2\text{Sb}_4$ 材料的实验结果, 但仍不能解释 $s > 1$ 的情况.

四、结 论

1. 在扩展态中(高温时)载流子输运是由热激发引起的直流电导占优势, 遵从

$$\sigma_{dc} = \sigma_0 e^{-\Delta E/kT}$$

之关系, 与频率无关.

2. 定域态中(低温时), 载流子输运主要由交流电导所支配. 遵从 $\sigma_{ac}(\omega) = A\omega^s$, $0.99 < s < 1.095$ 之关系, 与温度无关.

3. 本材料之直流电导和激活能均有退火效应.

4. 直流电导是外电场场强的函数.

(下转第 300 页)